

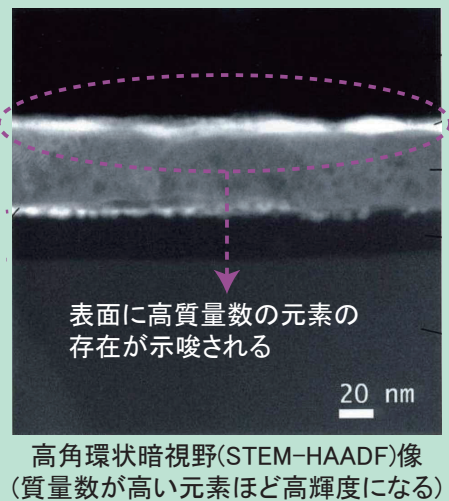
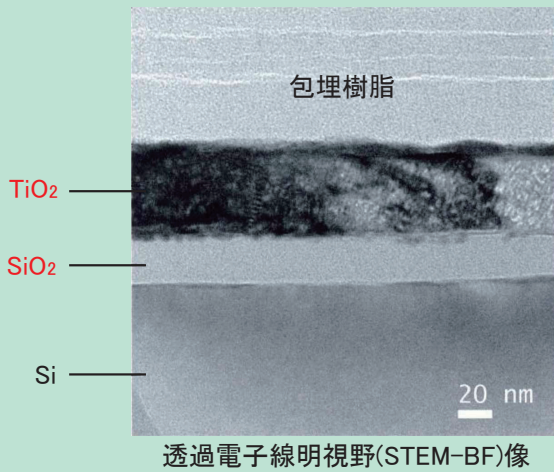
PV分析事例(4) 白濁部Siセルの分析

概要

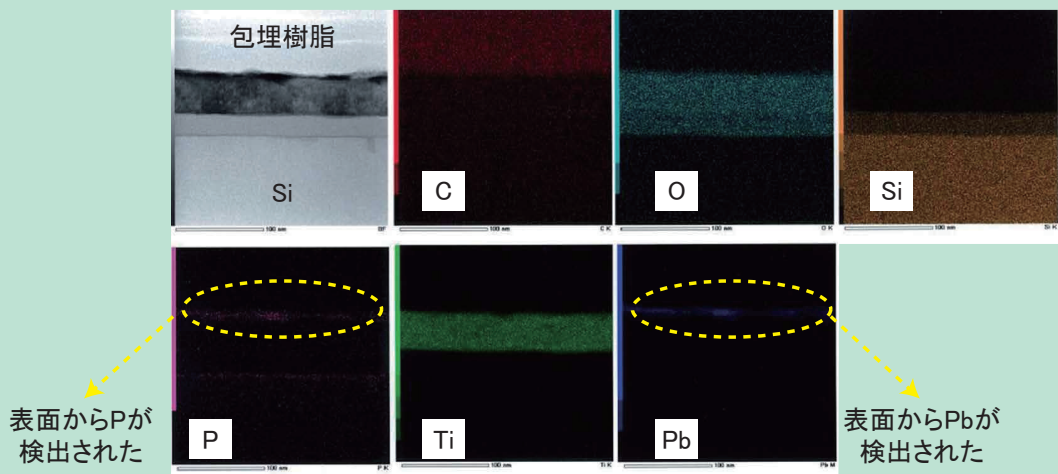
PVモジュールのSiセルの微小な領域の断面観察や組成分析を通じて、不良原因推定するデータを提供する。

● 分析例 白濁部Siセルの表面付近断面観察と元素マッピング

白濁部Siセルの断面観察



白濁部Siセルの断面元素マッピング(EDS)



株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

営業部 ☎03-5524-3851